Support Request Form　利用相談フォーム

Please fill in this form and send it to Nanostructural Characterization Group office as an email attachment.

依頼内容をご記入いただき、ナノ構造解析グループ事務局までメール添付にてお送りください。

*Email: tem@nims.go.jp*

Nanostructural Characterization Group staff takes counsel with you based on this.

以下の内容をもとに利用相談を行います。

〈Date日付: *month*月 *day*日 *year*年〉

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User**  利用者 | **Name**氏名（フリガナ） | |  | | | |
| **Company (Organization)/Division**  会社（組織）名・所属 | |  | | | |
| **Job Title/Position**職名/肩書 | |  | | | |
| **Grade** For students  **Period of stay in NIMS** for members of NIMS internship program | | | |  | |
| **Period of stay in NIMS** for visiting researchers | | | |  | |
| **E-mail address** |  | | **Phone Number** | |  |
| **Supervisor**  責任者 | **Name**氏名（フリガナ） | |  | | | |
| **Company (Organization)/Division**  会社（組織）名・所属 | |  | | | |
| **Job Title/Position**職名/肩書 | |  | | | |
| **E-mail address** |  | | **Phone Number** | |  |

|  |
| --- |
| **Questionnaire for usage type**ご利用形態についてご質問 |
| Please select either A or B  A　 I would like to be able to independently operate an instrument and get data by myself.  自分で機器を操作しデータを取得したい。  ▶Which instrument would you like to use? (If there is a model you want to use, please write down the name)  ご希望の装置を以下からお選びください。（使用したい機種がある場合は装置名をご記入ください）  TEM ：  FIB ：  Others その他：  　 ▶What about your experience?  Having no experience at all 全く経験がない  Having enough practical skill 十分経験がある  　 ▶If you are an experienced user, please tell us the name of instruments like *JEM-2100* you are familiar with, if any.  使い慣れている装置があればメーカーや機種等を教えて下さい。（JEM-2100等）    B　 I would like to request Analytical Support Service on my behalf.  分析支援サービスを技術代行で依頼したい。  Sample preparation and TEM observation 試料作製とTEM観察  Only sample preparation 試料作製のみ  Only TEM observation 　TEM観察のみ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Research Summary / Sample Information**研究概要/試料情報 | | | | | |
| **Research Summary**  研究概要 |  | | | | |
| **Sample Type, Form, Structure** 試料の構成 | | | | | Bulkバルク　 Monolayer単層膜　 Multilayer多層膜  Nano-Particles　ナノ粒子　 Others: その他： |
| **Electrical Characteristics**電気特性 | | | Conductor導体、 Semi-conductor半導体、 Insulator絶縁体 | | |
| **Magnetic Property**磁気特性 | | Ferromagnetic (Fe/Co/Ni）強磁性（鉄/コバルト/ニッケルなど）  Ferrimagnetic (Ferrite etc.) フェリ磁性（フェライトセラミックスなど）  Non-Magnetic非磁性 | | | |
| **Elements contained in the sample**含有元素 | | | |  | |
| **Remarks (if any)**特記事項 | |  | | | |

* **The following form is for only users who want a usage type “Technical Surrogate”.**

***“Technical Surrogate” is a usage type that Nanostructural Characterization Group analyzes on your behalf.***

**以下は技術代行をご希望の方のみご記入ください。**

* If you do not have enough space, please add pages. Other attachment accepted.

スペースが足りない場合は、ページを追加してください。別紙添付でも可

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Information Needed for Analysis Request**分析依頼に必要な情報 | | | |
| **Sample Name**試料名 |  | | |
| **Precautions when handling sample**  試料に関する注意事項 | Toxic劇物・毒物　　 Diffusible拡散性　 Volatile揮発性  Oxidizable酸化性  Heat-resistant temperature(　　　　 ℃ ) 耐熱温度［　　　　　℃］  Intolerance for organic solvent such as ethanol or acetone  耐薬品性（アセトン・エタノール）  Oxidizable酸化性  Photoreactive光反応性  Destruction Allowed破壊可　 Destruction not Allowed破壊不可  Others to be notedその他［　　　 　　　　 ］ | | |
| **Number of Samples** 試料数 | | |  |
| **Please set priorities for which sample to start with if there are 2 samples.**  ２個ある場合、優先順位 | | |  |
| **Directions of sample observation**観察方向 | | Cross section断面  Plan view平面  Any direction 方位不問 | |
| **Detailed information about your sample**詳細な試料情報  *※ You don’t need this information if you request only TEM observation.　TEM観察・分析のみ依頼の場合は不要* | | | |
| *Initial form, size, surface roughness, crystal orientation to observe, region of interest as specifically as possible to easy understand using schematic drawings or photos.　In case of Crash and Dispersion method, write the name of usable and unusable solvent.*  *初期形状・サイズ、表面の状態、観察したい結晶方位、特定の加工希望位置の全体写真とその部分の拡大写真、平面図、断面図などわかるように記載ください。分散法など懸濁が必要な場合は、使える溶媒と使えない溶媒を記載ください*。 | | | |
| **Storage and disposal of samples**  試料の保管と廃棄について | **Your samples we received will be disposed of 3 months after analysis is completed.**  お預かりした試料は、分析が完了してから3か月後に廃棄させて頂きます。  I give my consent to the above explanation上記の説明に同意する  I would like to return the samples. 試料の返却を希望する | | |
| **Detailed information about analytical techniques you request**依頼したい分析手法  *※ You don’t need this information if you request only sample preparation. 試料加工のみ依頼の場合は不要* | | | |
| *HR-TEM, STEM-EDS, STEM-EELS, EDS Mapping, Line Analysis, Electron Diffraction Pattern etc.　If you specify an instrument, please write its name and the reason.*  *HR-TEM、STEM-EDS、STEM-EELS、マッピング、線分析、電子線回折図形等。機器の指定がある場合は、装置名と理由を記載ください。* | | | |